# (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平4-321986

(43)公開日 平成4年(1992)11月11日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	ŧ	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G11B	25/04	101	Y	6255-5D		
	23/00		Н	7201-5D		
# G11B	17/04	301	K	7719-5D		

# 審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

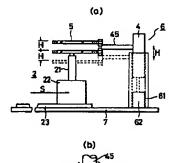
(21)出願番号	<b>特顧平3-115306</b>	(71)出顧人		
(00) 11177 7	TT-0 0 hr (1004) 4 TT-0 TT		日立電子エンジニアリング株式会社	
(22)出顧日	平成3年(1991)4月19日		東京都千代田区大手町2丁目6番2号	
		(72)発明者	中台 勉	
			東京都千代田区大手町二丁目6番2号	日
			立電子エンジニアリング株式会社内	
		(72)発明者	木村 誠章	
			東京都千代田区大手町二丁目6番2号	日
			立電子エンジニアリング株式会社内	
		(72)発明者	本郷 勉	
			東京都千代田区大手町二丁目6番2号	日
			立電子エンジニアリング株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 梶山 佶是 (外1名)	
		1		

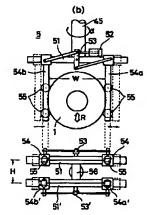
# (54) 【発明の名称】 デイスクのチヤツク反転機構

## (57)【要約】 (修正有)

【目的】 1枚の検査中に検査済のディスクを交換して 検査のスループットを向上する。

【構成】 2枚のディスク1を一定の間隔Hをなして別々に脅脱自在にチャックし、ディスクを解放して検査装置のスピンドル21に対してローディングするチャック部5と、チャックされたディスクを反転し、または一定の間隔Hに等しい距離を昇降する反転/昇降部6とにより構成される。チャック部は、ガイド棒51と、エアシリング52に駆動されたクランク機構53により、ガイド棒に沿って移動してディスクの円周エッジを両側でチャックする2本のチャックアーム54a,54bを1組とし、このチャックアームの2組を上記の一定の間隔Hとして結合する。また、反転/昇降部は、カム板の1回転により半回転するゼネパ歯車を有する反転部4と、反転部を上記の一定の間隔に等しい距離を昇降させるエアシリング61とよりなり、チャック部の結合部56の中心点をゼネバ歯車の反転軸45に固定する。





1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 水平な2枚のディスクを上下に一定の間 隔をなして別々に着脱自在にチャックするチャック部 と、酸チャック部を反転し、または前配一定の間隔に等 しい距離を昇降する反転/昇降部とにより構成され、該 ディスクを検査装置のスピンドルに対してローディング /アンローディングし、 該ディスクの検査中に次位のデ ィスクをチャックして待機させることが可能なことを特 徴とする、ディスクのチャック反転機構。

リンダに駆動されたクランク機構により、該ガイド棒に 沿って移動して前配着脱自在にディスクをチャックする 2本のチャックアームを1組とし、かつ該チャックアー ムの2組を前配一定の間隔として結合してなる、請求項 1 記載のディスクのチャック反転機構。

【請求項3】 前記反転/昇降部は、カム板の1回転に より半回転するゼネパ歯車を有する反転部と、該反転部 を前記一定の間隔に等しい距離を昇降させるエアシリン ダとにより構成され、前記ゼネパ歯車の反転軸に前記チ ャック部の結合の中心点を固定する、請求項1記載のデ 20 ィスクのチャック反転機構。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、ディスクをチャック して反転する機構に関し、詳しくは被検査のディスクを チャックし、その両面を検査するためにディスクを反転 し、検査中に次のディスクをチャックして待機させ、検 査のスループットを向上できる機構に関するものであ る。

## [0002]

【従来の技術】磁気ディスクなどのディスクは検査装置 により表面欠陥が検査される。両面が有効面の場合はデ ィスクを半回転、すなわち反転して検査される。

【0003】図3は両面検査のためのディスクの反転動 作を説明するもので、回転機構2のスピンドル21にロー ディングされた被検査のディスク1は、モータ22により 回転され、検査部において検査される。片面の検査が終 了すると、矢印Sにより回転機構がチャック機構3の位 置まで移動して(イ) となり、矢印Aによりチャック機構 いで矢印Bにより上昇して(ハ) の矢印Cの方向に反転さ れ、再び矢印B′により下降してスピンドルにローディ ングされ、回転機構が検査部まで移動して反対面が検査 される。両面検査が終了すると、別途の搬送機構により このディスクをチャック機構から取り除いた後、次のデ ィスクがチャックされて交換される。

【0004】以上のようにチャック機構の動作は単純な 繰り返しであるが、昇降位置と反転角度は正確なことが 必要であり、これをロボットにより行うときはかなり複 雑な制御を必要とする。これに対して、この発明の発明 50 アシリンダとにより構成され、チャック部の結合の中心

者により、簡易で正確に昇降/反転ができるものとし て、「ワーク反転用カム機構、特願平 2-219419 号、平 成2.08.21 」が特許出願されている。図4は上記の特許 出願にかかるワーク反転用カム機構の反転部4を示す。 (a)は斜視図で、支持板41にカム板42と、これに係合し たゼネバ歯車44とを軸支する。カム板をモータ43により 1回転すると、ゼネパ歯車が半回転して反転軸45が反転 する。反転軸に上記のチャック機構3を固定してディス クを反転させる。図の(b) は、カム板の回転角度 $\theta$ に対 【請求項2】 前記チャック部は、ガイド棒と、エアシ 10 する、反転軸の回転角度lphaを示すもので角度lphaはheta=0~110°, 160~200°, 250~360°の範 囲で一定値に安定しており、それらの中間で間欠的に9 0° づつ変化する。このように安定範囲が広いので、カ ム板の回転角度が仮に正確でなくても、反転軸を正確に 反転することができる。なお、図(a) には省略したが上 記のカム板にクランクを取り付け、カム板の回転による 反転に連動して支持板を正確に昇降する機構とされてい る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】さて、磁気ディスクの 生産量の増加に対応して、その検査は流れ作業により行 われている。しかし、最近においてはさらに需要と生産 が増加したために、従来以上に検査速度を向上すること が要請され、検査自体を迅速化することが検討されて実 行されている。しかし、上記したディスクの交換にはか なりの時間が必要とされているので、これを短縮するこ とにより検査のスループットを向上することができる。 この発明は以上に鑑みてなされたもので、チャック機構 の構造を2枚のディスクをチャックできるものに改良 30 し、1枚の検査中に検査済のものを交換して交換時間を 短縮できるチャック反転機構を提供することを目的とす るものである。

### [0006]

【課題を解決するための手段】この発明はディスクのチ ャック反転機構であって、水平な2枚のディスクを上下 に一定の間隔をなして別々に着脱自在にチャックするチ ャック部と、チャックされたディスクを反転し、または 上配の一定の間隔に等しい距離を昇降する反転/昇降部 とにより構成され、ディスクを検査装置のスピンドルに が下降して(ロ) となってディスクがチャックされる。つ 40 対してローディング/アンローディングし、ディスクの 検査中に次位のディスクをチャックして待機させること を可能とするものである。上記のチャック部は、ガイド 棒と、エアシリンダに駆動されたクランク機構により、 ガイド棒に沿って移動してディスクの円周エッジを両側 でチャックする2本のチャックアームを1組とし、この チャックアームの2組を上記の一定の間隔として結合し て構成される。また、上記の反転/昇降部は、カム板の 1回転により半回転するゼネパ歯車を有する反転部と、 反転部を上記の一定の間隔に等しい距離を昇降させるエ 点をゼネパ歯車の反転軸に固定したものである。 [0007]

【作用】上記のチャック反転機構においては、チャック 部のチャックアームはエアシリンダとクランク機構によ り移動し、2枚のディスクが水平状態で別々に着脱自在 にチャックされる。チャック部は反転部のゼネパ歯車に より正確に反転され、また必要に応じて反転/昇降部の エアシリンダにより一定の間隔だけ昇降して、いずれか のディスクを解放して検査装置のスピンドルにローディ ングし、またこれをチャックしてアンローディングす 10 と下側のチャックアームにチャックされて(^) となり、 る。このチャック反転機構の制御方法は、2組のチャッ クアームの一方にディスクをチャックして反転または昇 降し、スピンドルに対してディスクをローディング/ア ンローディングしてその両面に対する検査を行い、この 検査中に次位のディスクを他方のチャックアームにチャ ックして検査に対して特機することができ、これにより ディスクの交換時間が短縮される。

[0008]

【実施例】図1はこの発明の一実施例の構造を示し、 (a) はチャック反転機構と検査装置の回転機構の側面 20 査のスループットが短縮される。 図、(b) はチャック部5の平面および正面図である。図 1(a) において、反転/昇降部6はペース盤7にガイド 板61とエアシリンダ62と、エアシリンダによりガイド板 に沿って一定距離Hだけ昇降する反転部4とにより構成 する。反転部は前配した図4(a) のものとし、その反転 軸45にチャック部5を取り付ける。ペース盤7は検査装 置と共通とし、検査装置の回転機構2は、レール23に沿 って矢印Sのように移動してチャック部5の下に停止す る。チャック部は反転し、または必要により一定距離H を昇降してディスクを回転機構のスピンドル21に対して 30 ある。 ローディングし、またはアンローディングする。図(b) に示すチャック部5は、ガイド棒51と、ガイド棒に軸支 され、エアシリンダ52に駆動されるクランク機構53と、 クランク機構によりガイド棒に沿って移動する2本1組 のチャックアーム54a,54b を設ける。各チャックアーム にはディスク1の円周エッジに対応する位置に2個のロ ーラー55が取り付けられる。両チャックアームの間隔w を変化し、これが狭いとき円周エッジを両側でチャック し、間隔wを広くするとディスクが解放される。この2 本1組のチャックアームの2組を上記の一定の間隔Hと 40 して重ね合わせ、それぞれのガイド棒51と51′を結合部 56で結合し、結合部の中心が反転軸45に固定される。な お、チャックするとき、または解放するときはディスク は矢印Rの方向にアクセスされる。

【0009】図2により上記のチャック反転機構の制御 方法を説明する。(イ) において、ディスク1-1が他の箇 所から搬送されてチャック部4の上側のチャックアーム にチャックされたとし、ディスクの下側をA面、上側を B面とする。ここでチャック部を反転(矢印R)すると (ロ) となり、回転機構2がS方向に移動してディスクは 50

スピンドル21にローディングされる。ついで回転機構が 反対のS′方向に移動してA面が検査され、検査が終了 すると回転機構がS移動してディスクは再びチャックさ れる。つぎにチャック部は反転されて(A) となり、さら に距離Hを下降して(こ)となる。ここで(ロ)と同様な動 作がなされてB面が検査される。この検査中にチャック 部を距離Hを上昇して(ホ)とすると上側は空いているの でここに次位のディスク1-2を、A面を下側としてチャ ックして待機する。先のディスク1-1の検査が終了する これを反転して(h) としてディスク 1-2のA面が検査さ れる。この検査中に検査済のディスク1-1はチャック部 から取り去られて他の箇所に搬送される。A面の検査が 終了したディスク1-2をチャックしたチャック部は、再 び反転されて(チ)、すなわち(ハ)に戻り、以下、上記と 同様な動作により検査が繰り返される。以上により、次 位のディスクが検査中の(\*) においてチャックされて待 機し、検査済のディスクはやはり検査中の(ト) において 取り去られるので、ディスクの交換時間がかからず、検

[0010]

【発明の効果】以上の説明のとおり、この発明によるチ ャック反転機構においては、両面検査のためにディスク を正確に反転する反転機能を有するとともに、2枚のデ ィスクを同時にチャックできるチャック部を設けたもの で、これによりディスクの検査中に、検査済のディスク をつぎに検査されるディスクに交換して待機させ、検査 のスループット時間を短縮することができ、ディスク検 査装置の稼働率の向上に寄与する効果には大きいものが

## 【図面の簡単な説明】

この発明の一実施例を示し、(a) はチャック 反転機構と検査装置の回転機構の側面図、(b) はチャッ ク部5の平面および正面図である。

【図2】 この発明によるチャック反転機構の制御方法 の説明図である。

【図3】 ディスク検査装置におけるディスクの反転の 説明図である。

【図4】 特許出願にかかる「ワーク反転用カム機構」 の反転部の斜視図とその動作を示す曲線図である。

# 【符号の説明】

1, 1-1, 1-2…ディスク、2…回転機構、21…スピン ドル、22…モータ、23…レール、3…チャック機構、4 …反転部、41…支持板、42…カム板、43…モータ、44… ゼネパ歯車、45…反転軸、5…チャック部、51,51 ′ … ガイド棒、52…エアシリンダ、53,53 ′ …クランク機 54a, 54a', 54b, 54b' …チャックアーム、55… ローラー、6…反転/昇降部、61…ガイド板、62…エア シリンダ、7…ペース盤。

